

CEI 60749-11
(Première édition – 2002)

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 11: Variations rapides de température –
Méthode des deux bains**

IEC 60749-11
(First edition – 2002)

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 11: Rapid change of temperature –
Two-fluid-bath method**

CORRIGENDUM 1

Page 10

Tableau 1 – Tolérances de températures
de choc thermique et fluides suggérés

Sous A – Température
Dans rangée Etape 2 – Tolérance de
température

Au lieu de: -40_{-30}^0 ,

lire: -40_{-10}^0 .

Page 11

Table 1 – Thermal shock temperature
tolerances and suggested fluids

Under A – Temperature
In row Step 2 – Temperature tolerance

Instead of: -40_{-30}^0 ,

read: -40_{-10}^0 .

[IEC 60749-11:2002/COR1:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/5c410b2e-35ee-414a-8a6c-4aa01e8fdce5/iec-60749-11-2002-cor1-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/5c410b2e-35ee-414a-8a6c-4aa01e8fdce5/iec-60749-11-2002-cor1-2003>